

単価表（所内向け）

2024年4月1日 電子顕微鏡施設

つくば中央5群（Tecnai Osiris、JEM-ARM200F、閑散期・通常期の区別なし）

利用内容		課金単位	課金額（円、税抜き）
【技術代行（依頼観察）】	Osiris基本料金	1日	350,000
	ARM基本料金	1日	150,000
【技術代行（依頼観察・オプション）】	OsirisSTEM-EELS（解析含む）	1試料（標準時間8時間）	200,000
	Osirisクライオ観察	1回	200,000
	Osiris加熱観察	1回	200,000
	Osiris時間分割測定	1回	200,000
	Osirisトモグラフィー観察（3Dデータ構築まで）	1視野	200,000
	Osirisデータ解析・評価料	1試料（標準時間4時間）	100,000
	ARMSTEM EELSスペクトル	1視野	100,000
	ARMSTEM EDSスペクトル	1視野	100,000
	ARM STEM EELS解析	1視野	200,000
	ARM STEM EELS-EDS元素マッピング	1視野	200,000
【技術代行（試料作製等）】	ARM in-situ 冷却、加熱、時間分割測定	1視野	200,000
	ウルトラミクロトーム法	1時間	10,000
	クライオウルトラミクロトーム法	1時間	12,000
【運転費】	Ar-イオンミリング法	1時間	12,000
	スペシャリスト（契約職員級）	1時間	0
	業務クラス1（ユニット長級）	1時間	50,000
	業務クラス2（グループ長級）	1時間	40,000
	業務クラス3（主任研究員級）	1時間	30,000
【技術指導費】	業務クラス4（研究員級）	1時間	20,000
		1回	50,000
【共用施設等使用料（セルフ利用）】 産総研職員でかつ装置管理者の許可を得た者のみ	Osiris（但し、新規セルフ利用不可）	1日	30,000
	ARM	1日	30,000
【大口ユーザー等の特典】 上記の合計に左の係数をかけたものが課金額。	なし		1
	昨年度もしくは今年度100万円以上～200万円未満利用		0.6
	昨年度もしくは今年度200万円以上～300万円未満利用		0.5
	昨年度もしくは今年度300万円以上利用		0.4
	初回利用		0.5

つくば中央6群、東地区（H-7600、JSM-7400F、FB-2100）

（単位は円、税抜き）

利用内容		課金単位	閑散期※ （4月～7月）	通常期 （8月～3月）
【技術代行（依頼観察）】	TEM形状撮影	1試料	33,050	50,400
	SEM形状撮影：生物系	1試料	13,000	19,800
	SEM形状撮影：材料系	1試料（標準時間2時間）	9,750	14,850
	SEM分析	1試料（標準時間4時間）	19,650	29,850
【技術代行（試料作製等）】	FIB加工、TEM用試料	半日/枠	26,670	40,000
	FIB加工、SEM用試料	半日/枠	26,670	40,000
	ウルトラミクロトーム、生物系	1試料	43,500	62,600
	SEM用試料作製：生物系	1試料	16,400	23,400
	SEM用試料作製	1時間	12,300	17,550
【共用施設等使用料（セルフ利用）】 装置管理者の許可を得た者のみ	SEMセルフ利用	1枠（半日）	8,850	15,450
	FIBセルフ利用	1枠（半日）	11,700	20,550
	SEM使用講習	1回	37,000	37,000
	FIB使用講習	1回	73,000	73,000

関西センター（Tecnai G2 F20、S-5500）

（単位は円、税抜き）

利用内容		課金単位	閑散期※ （4月～7月）	通常期 （8月～3月）
【技術代行（依頼観察）】	TEM形状撮影	1試料（標準時間2～4時間）	41,300	51,700
	TEM分析シングル	1試料（標準時間2～4時間）	57,300	71,600
	TEM分析マルチ	1試料（標準時間2～4時間）	76,400	95,500
	TEMトモグラフィー	1試料（標準時間2～4時間）	82,700	103,400
	SEM形状撮影	1試料（標準時間2～4時間）	11,800	14,800
	SEM分析	1試料（標準時間2～4時間）	23,800	29,800
	雰囲気遮断観察（上記に加算）	1試料	10,800	13,600
【技術代行（試料作製等）】	イオンミリング、平面	1試料（標準時間2～4時間）	65,100	81,300
	イオンミリング、断面	1試料（標準時間2～4時間）	105,800	132,300
	ウルトラミクロトーム、高分子系	1試料（標準時間2～4時間）	56,900	71,200
	ウルトラミクロトーム、生物系	1試料（標準時間2～4時間）	65,100	81,300
	クライオ試料作製	1試料（標準時間2～4時間）	81,400	101,700
	レプリカ試料作製	1試料	48,600	60,800
	SEM用試料作製	1時間	12,100	15,200
	画像処理・画像解析	1時間	8,100	10,100
【共用施設等利用料（セルフ利用、許可を得た者のみ）】	その他技術代行費**		実費を請求	実費を請求
	TEM観察	半日/枠	16,400	20,500
	SEM観察	半日/枠	12,300	15,400
	TEM使用講習	回	100,000	100,000
	SEM使用講習	回	50,000	50,000

※標準時間を超過する場合、試料複数個分課金額として請求することがある。

**産総研の他の共用設備を利用する等、依頼内容の実施に必要な作業を別途行う際の技術代行費等

単価表（所外向け）

2024年4月1日 産業技術総合研究所 電子顕微鏡施設

つくば中央5群（Tecnai Osiris、JEM-ARM200F、閑散期・通常期の区別なし）

利用内容		課金単位	課金額（円、税抜き）
【技術代行（依頼観察）】	Osiris基本料金	1日	350,000
	ARM基本料金	1日	150,000
【技術代行（依頼観察・オプション）】	OsirisSTEM-EELS（解析含む）	1試料（標準時間8時間）	200,000
	Osirisクライオ観察	1回	200,000
	Osiris加熱観察	1回	200,000
	Osiris時間分割測定	1回	200,000
	Osirisトモグラフィ観察（3Dデータ構築まで）	1視野	200,000
	Osirisデータ解析・評価料	1試料（標準時間4時間）	100,000
	ARMSTEM EELSスペクトル	1視野	100,000
	ARMSTEM EDSスペクトル	1視野	100,000
	ARM STEM EELS解析	1視野	200,000
	ARM STEM EELS-EDS元素マッピング	1視野	200,000
	ARM in-situ 冷却、加熱、時間分割測定	1視野	200,000
【技術代行（試料作製等）】	ウルトラマイクロトム法	1時間	10,000
	クライオウルトラマイクロトム法	1時間	12,000
	Arイオンミリング法	1時間	12,000
【運転費】	スペシャリスト（契約職員級）	1時間	0
	業務クラス1（ユニット長級）	1時間	50,000
	業務クラス2（グループ長級）	1時間	40,000
	業務クラス3（主任研究員級）	1時間	30,000
	業務クラス4（研究員級）	1時間	20,000
【技術指導費】		1回	50,000
【共用施設等使用料（セルフ利用）】 産総研職員でかつ装置管理者の許可を得た者のみ	Osiris （但し、新規セルフ利用不可）	1日	30,000
	ARM	1日	30,000
【大口ユーザー等の特典】 上記の合計に左の係数をかけたものが課金額。	なし		1
	昨年度もしくは今年度100万円以上～200万円未満利用		0.6
	昨年度もしくは今年度200万円以上～300万円未満利用		0.5
	昨年度もしくは今年度300万円以上利用		0.4
	初回利用		0.5

つくば中央6群、東地区（H-7600、JSM-7400F、FB-2100）

（単位は円、税抜き）

利用内容		課金単位	閑散期※ （4月～7月）	通常期 （8月～3月）
【技術代行（依頼観察）】	TEM形状撮影	1試料	49,570	75,600
	SEM形状撮影：生物系	1試料	19,500	29,700
	SEM形状撮影：材料系	1試料（標準時間2時間）	9,750	14,850
	SEM分析	1試料（標準時間4時間）	19,650	29,850
【技術代行（試料作製等）】	FIB加工、TEM用試料	半日/枠	26,670	40,000
	FIB加工、SEM用試料	半日/枠	26,670	40,000
	ウルトラマイクロトム、生物系	1試料	65,250	93,900
	SEM用試料作製:生物系	1試料	24,600	35,100
	SEM用試料作製	1時間	12,300	17,550

※標準時間を超過する場合、試料複数個分課金額として請求することがある。

※上記課金額に運営管理費15%を乗じた額が支払金額になる。

※産総研外に公開されていない産総研内メニューを所外ユーザーが利用するには産総研と技術コンサルティングや共同研究契約を結ぶ必要があります。詳細は産総研電子顕微鏡事務局（M-electron-microscopy-ml@aist.go.jp）まで御連絡ください。